

## НЕОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ВЧ ПРЫЖКОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ

Гальперин Ю. М., Приев Э. Я.

Рассмотрены неомические эффекты в ВЧ прыжковой проводимости  $\sigma(\omega)$  в полупроводниках в случае, когда доминирует релаксационный механизм поглощения. Проанализированы зависимости неомического вклада в  $\text{Re } \sigma(\omega)$  от частоты  $\omega$ , температуры  $T$  и амплитуды  $\mathcal{E}_0$  переменного электрического поля. Показано, что в случае достаточно низких частот указанный неомический вклад пропорционален  $|\mathcal{E}_0|$ . Причина такой неаналитической зависимости состоит в том, что основную роль в этой ситуации играют пары доноров с расстоянием между уровнями, гораздо меньшим  $T$ , для которых отклик на поле существенно нелинеен. Рассмотрена зависимость неомической части  $\text{Re } \sigma(\omega)$  от магнитного поля.

При низких температурах ВЧ прыжковая проводимость  $\sigma(\omega)$  слабо легированных и некристаллических полупроводников обусловлена прыжками электронов между примесными центрами, расстояние между которыми меньше среднего [1]. Основной вклад в  $\text{Re } \sigma(\omega)$  дают два механизма: резонансный (бесфононный) и релаксационный [1, 2]. В случае достаточно низких частот  $\omega$  и не слишком низких температур  $T$  главную роль играет второй механизм, обусловленный модуляцией расстояния  $E$  между уровнями энергии электрона, локализованного на паре центров, переменным электрическим полем  $\mathcal{E}$ ;  $E = (\Delta^2 + \Delta_0^2)^{1/2}$ ,  $\Delta$  — разность одноузельных энергий,  $\Delta_0$  — туннельное расщепление уровней.

Теория неомических эффектов ВЧ прыжковой проводимости при релаксационном механизме была построена в работе [3]. Важную роль при создании этой теории сыграли работы Шкловского и Эфроса [2, 4]. В этих работах показано, что для правильного подсчета числа пар, дающих вклад в поглощение, необходимо учитывать кулоновскую корреляцию чисел их заполнения.

Главный вклад в омическую ВЧ проводимость дают пары, у которых  $E \sim T$ . Неомические эффекты определяются отношением амплитуды модуляции расстояния между уровнями  $d = e(\mathcal{E}_0 \cdot r)$  к характерному значению  $E \sim T$  (здесь  $\mathcal{E}_0$  — амплитуда поля,  $r$  — «плечо» пары). Таким образом, параметром нелинейности является отношение  $u = e\mathcal{E}_0 r_c / T$ , где  $r_c$  — характерное значение плеча пары.<sup>1</sup>

В работе [3] был рассмотрен режим сильной нелинейности, когда  $u \gg 1$ . Однако в полупроводниках с мелкими примесными уровнями (типа  $n$ -InSb) такой режим трудно достигим экспериментально, поскольку при этом появляется возможность активации носителей в зону (примесный пробой) [5]. Поэтому для таких материалов основной интерес представляет режим слабой нелинейности, т. е. ситуация, когда  $d \ll T$  (или  $u \ll 1$ ).

Цель работы — рассмотреть неомические эффекты ВЧ прыжковой проводимости в режиме слабой нелинейности и проанализировать влияние магнитного поля  $H$ .

Наиболее интересным здесь является то, что неомическая поправка к  $\sigma(\omega)$  далеко не всегда пропорциональна  $u^2$ , как это могло бы показаться на первый

<sup>1</sup> Конкретное значение  $r_c$  будет приведено далее (табл. 1). Условием применимости двухузельной модели, которой мы пользуемся, является  $a \ll r_c \ll N^{-1/3}$ , где  $a$  — радиус локализации электронного состояния, а  $N$  — концентрация примесных центров.

взгляд. В частности, как мы увидим, неомический вклад в  $\sigma(\omega)$  может оказаться пропорциональным  $|u|$ . Физической причиной такой неаналитической зависимости является то, что омическая и неомическая части  $\sigma(\omega)$  определяются различными группами пар: первая — парами с  $E \leq T$ , а вторая — парами с малыми значениями  $E \leq E^* \leq T$ . Для последних нелинейность проявляется сильно, и их вклад в неомическую часть проводимости оказывается определяющим, несмотря на относительно малое число таких пар. Таким образом, исследование неомических эффектов дает возможность изучать парную функцию распределения примесных центров в области малых расстояний между уровнями.

Таблица 1

Значение  $P^{nl}/P_0$  в различных предельных случаях

Область параметров	$P^{nl}/P_0$	$r_c/a$
$\omega\tau_0 \gg 1$	$-0.17 \frac{d_0^2}{T^2}$	$\ln \frac{2I_0}{T}$
$1 \gg \omega\tau_0 \gg (d/T)^2$	$0.03 \frac{d_0^2}{T^2 \sqrt{\omega\tau_0}}$	$\ln \frac{2I_0}{E_1}$
$\omega\tau_0 \ll (d/T)^2$	$-0.15 \frac{d_0}{T}$	$\ln \frac{2I_0}{d_0}$

Примечание.  $d_0 = \epsilon b r_c$ .

Таблица 2

Отношение  $P(H)/P_0$  в сильном магнитном поле

Ориентация	$P(H)/P_0$	
	$k=4$	$k=3$
$\mathcal{E} \parallel \mathbf{H}$	$\frac{5\lambda^2 a_n^4}{2S_1 a^6} \sim H^{-1/2}$	$\frac{8\lambda^2 a_n^3}{3S_1 a^5} \sim H^{-1/2}$
$\mathcal{E} \perp \mathbf{H}$	$\frac{6}{S_1^3} \left(\frac{\lambda}{a}\right)^6 \sim H^{-3}$	$\frac{64\sqrt{2}}{\pi S_1^2} \left(\frac{\lambda}{a}\right)^5 \sim H^{-5/2}$

Примечание.  $\lambda = (c\hbar/eH)^{1/2}$ ,  $a_H = \hbar/\sqrt{2mE_H}$ .  $E_H$  — энергия связи донора в магнитном поле.

Мы будем вычислять мощность  $P$ , поглощаемую в единице объема, а величину  $\text{Re } \sigma(\omega)$  определять из соотношения

$$\text{Re } \sigma(\omega) = 2P/\epsilon_0^2. \quad (1)$$

Для анализа качественной картины рассмотрим вклад пары с  $E \ll T$  в линейное поглощение. Этот вклад определяется формулой Мандельштама—Леонтовича

$$P_0 \approx \frac{\omega^2 \tau}{1 + (\omega\tau)^2}, \quad (2)$$

где  $\tau$  — время релаксации заселенностей пар. Явный вид  $\tau$  определяется механизмом взаимодействия пар с тепловыми фононами. Мы рассмотрим наиболее простой случай, когда его можно представить в виде [3]

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} \left(\frac{\Delta_0}{T}\right)^2, \quad (3)$$

где  $\Delta_0 = 2I(\mathbf{r})$ ,  $I(\mathbf{r})$  — энергетический интеграл перекрытия волновых функций компонент пары [в отсутствие магнитного поля  $I(r) = I_0 \exp(-r/a)$ ]. Такое выражение соответствует, например, случаю деформационного взаимодействия при  $E < 2\hbar s/a$ ,  $s$  — скорость звука. Будем считать, что корреляция в расположении примесей отсутствует. Тогда с точностью до несущественных сейчас логарифмических множителей функция распределения параметра  $\Delta_0$  есть  $\Delta_0^{-1}$  (т. е. имеется экспоненциально широкий набор времен релаксации). С учетом этого вклад в поглощаемую мощность пар с  $E \leq E^* \leq T$  пропорционален

$$P_0 \propto \frac{1}{T} \int_0^{E^*} dE \arctg \frac{E^2}{\omega\tau_0 T^2}. \quad (4)$$

Используем это выражение для качественных оценок. Поскольку нас интересует слабая нелинейность, будем считать, что  $(P - P_0)/P_0 \approx (d/E)^2$ . Тогда получаем

$$P^{nl} = P - P_0 \propto \frac{1}{T} \int_0^{E^*} \arctg \frac{E^2}{\omega\tau_0 T^2} \left(\frac{d}{E}\right)^2 dE. \quad (5)$$

Анализ (5) позволяет сделать вывод, что при  $\omega\tau_0 \gg 1$  интеграл в (5) определяется верхним пределом, который в этом случае должен быть порядка  $T$ . Следовательно,

$$P^{nl}/P_0 \simeq (d/T)^2 \propto \varepsilon_0^2. \quad (6)$$

При  $\omega\tau_0 \ll 1$ , как видно из (5), возникает новое характерное значение энергии  $E_1 \simeq T \sqrt{\omega\tau_0} \ll T$ . Соответственно оценка для  $P^{nl}$  в этом случае имеет вид

$$\frac{P^{nl}}{P_0} \simeq \frac{d^2}{TE_1} \simeq \frac{d^2}{T^2 \sqrt{\omega\tau_0}} \propto \varepsilon_0^2. \quad (7)$$

Отсюда видно, что, поскольку  $\omega\tau_0$  стоит в знаменателе, в этом случае нелинейность поглощения наступает гораздо раньше, чем при  $\omega\tau_0 \gg 1$ . Выражения (6) и (7) справедливы лишь при  $E_1 \gg d$ , или

$$\omega\tau_0 \gg (d/T)^2. \quad (8)$$

Именно в этих случаях нелинейные добавки представляют собой члены разложения в ряд по параметру  $d/E$ . Если же  $E_1 \ll d$ , или

$$\omega\tau_0 \ll (d/T)^2, \quad (9)$$

то ситуация становится аналогичной той, которая имеет место при  $d \gg T$  (сильная нелинейность) [3]. Поэтому  $P^{nl}/P_0$  определяется отношением чисел пар с  $E \leq d$  и  $E \leq T$

$$\frac{P^{nl}}{P_0} \simeq \frac{|d|}{T} \propto |\varepsilon_0|. \quad (10)$$

Отсюда видно, что при  $\omega\tau_0 \ll 1$  (что соответствует типичной экспериментальной ситуации) за нелинейное поглощение ответственны пары с малыми  $E$ .

Для нахождения численных коэффициентов для оценок (6), (7) и (10) необходимо рассматривать точное выражение для поглощения, определяемого одной парой, полученное в [3]. При этом в случае  $\omega\tau_0 \ll 1$  можно сделать ряд упрощений в этом выражении, обусловленных тем, что главную роль здесь играют пары с малыми  $E$ . Для этого случая имеем

$$p = \frac{\omega}{8\pi T} \int_0^{2\pi} dt \int_0^{2\pi} dt' E(t) E(t-t') \frac{\exp(-\rho\gamma t')}{1 - \exp(-2\pi\rho\gamma)}, \quad (11)$$

где  $\gamma = \frac{1}{\omega\tau_0} (E/T)^2$ ,  $E(t) = \sqrt{(E\sqrt{1-\rho} + d \cos t)^2 + \rho E^2}$  — расстояние между уровнями под действием возмущения со стороны внешнего поля  $\mathcal{E}$ ,  $\rho = (\Delta_0/E)^2$ . Если здесь ввести фурье-компоненты функций  $E(t)$ ,  $E_n$  и учесть, что при  $E \ll T$  линейный вклад

$$p_0 = \pi d^2 (1-\rho) \frac{\omega\gamma\rho}{1 + (\rho\gamma)^2}, \quad (12)$$

то нелинейная часть поглощения равна

$$p^{nl} \equiv p - p_0 = \frac{\rho\omega\gamma}{8T} \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 E_n^2}{n^2 + \rho^2 \gamma^2} - \frac{d^2 (1-\rho)}{1 + (\rho\gamma)^2} \right\}. \quad (13)$$

В случае  $\omega\tau_0 \gg 1$  нелинейное поглощение для одной пары вычисляется так же, как и при  $\omega\tau_0 \ll 1$ , только вид фурье-коэффициентов будет более сложным, поскольку здесь уже не удастся осуществить упрощения в формуле для  $p$  за счет области малых энергий.

При определении полного поглощения  $P$  необходимо помимо усреднения по  $E$  и  $\rho$  выполнить усреднение по направлениям  $\mathbf{n}$ , где  $\mathbf{n} = (\mathbf{r}/r)$  — направление дипольного момента пары,

$$P = 2\pi a^2 \int_0^{\infty} dE \int_0^1 d\rho \frac{F(E\sqrt{1-\rho}, a)}{\rho\sqrt{1-\rho}} S_{\mathcal{K}}(E\sqrt{\rho}, \mathbf{n}) \rho(E, \rho, \mathbf{n}), \quad (14)$$

Где парная функция распределения  $F(E\sqrt{1-\rho}, a)$ , а выражение для  $S_k$  определяется, как в [6]. Результаты усреднения для нелинейной части поглощения, отнесенной к линейной в различных предельных случаях, представлены в табл. 1.

Внешнее магнитное поле деформирует волновую функцию примесного электрона, причем различным образом в зависимости от угла между плечом пары и  $H$ . Это приводит к тому, что интеграл перекрытия  $I(r)$  начинает зависеть от поля  $H$ . При этом в зависимости от соотношения между магнитной длиной  $\lambda=(c\hbar/eH)^{1/2}$  и радиусом локализации электрона существуют две области с различной зависимостью  $P(H)$ : сильные и слабые поля. Наиболее существенным для эксперимента является случай сильного поля, т. е.  $\lambda/a \ll 1$  (в противоположном предельном случае возникают лишь малые поправки к поглощению, пропорциональные  $H^2$ ). Учет влияния магнитного поля на поглощение производится при усреднении нелинейной части поглощения  $P^{nl}$  по всем направлениям  $n$ , так же как это делалось в [6]. Результаты зависимостей  $P^{nl}(H)$  для различных ориентаций магнитного поля в разных предельных случаях приведены в табл. 2 ( $k$  — показатель степени  $P^{nl} \sim d^k$ ).

Мы благодарны Б. И. Шкловскому за чтение рукописи и полезные замечания.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Pollak M., Geballe T. H. — Phys. Rev., 1961, v. 122, N 6, p. 1742—1752.
- [2] Efros A. L., Shklovskii B. I. — In: Electron-electron interactions in disordered systems, v. 10 / Ed. by A. L. Efros, M. Pollak. Amsterdam, 1985, p. 409—482.
- [3] Гальперин Ю. М., Гуревич В. Л., Паршин Д. А. Высокочастотная прыжковая проводимость полупроводников. Теория нелинейных и квантовых явлений. — ЖЭТФ, 1983, т. 85, в. 11, с. 1757—1770.
- [4] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Бесфононная прыжковая проводимость неупорядоченных систем на переменном токе. — ЖЭТФ, 1981, т. 81, в. 1, с. 406—415.
- [5] Гальперин Ю. М., Дричко И. Л., Литвак-Горская Л. Б. Влияние примесного пробоя на поглощение ультразвука в компенсированном  $n$ -InSb. — ФТТ, 1986, т. 28, в. 11, с. 3374—3379.
- [6] Гальперин Ю. М., Прнев Э. Я. Акустические свойства полупроводников в режиме прыжковой проводимости. — ФТТ, 1986, т. 28, в. 3, с. 692—700.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе АН СССР  
Ленинград

Получена 18.06.1987  
Принята к печати 22.09.1987